

ผลงานวิจัย

ระดับผลงาน :	OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
รหัสผลงาน :	620701000029
ชื่อผลงาน :	Temperature effects on BTI and soft errors in modern logic circuits
ชื่อวารสาร/ ชื่อการประชุม :	Microelectronics Reliability
อาจารย์ที่เข้าร่วม :	Sasithon Chookaew Suppachai Howimanporn
นักศึกษาที่เข้าร่วม :	
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ :	01/08/2561 - 31/08/2561
ฉบับที่ :	
เล่มที่ :	
ค่าน้ำหนัก :	1.00
